

2000nm 近红外物镜



产品描述

在 1000–2000nm 附近具有高透射率的物镜。用于半导体器件故障分析，以检测漏电流发出的极微弱发射。当红外光从芯片背面穿过硅时，可以很好地观察到高度集成和多层布线的半导体。注：硅校正镜片也可提供。

产品特点

宽波段高透射率（超过 70%）；多个倍率可以选择

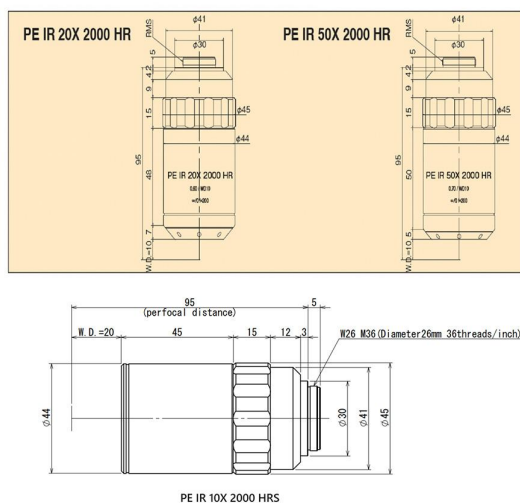
应用领域

半导体分析 | 生物医学

核心参数

无
无

尺寸图



详细参数

参数:

Model	MP Plan 10X 2000HRS	MP 20X 2000HR	MP 50X 2000HR
放大倍率	10X	20X	50X
工作距离	20mm	10mm	10mm
焦距(f)	20mm	10mm	4mm
N.A	0.33	0.6	0.7
明晰度	2.9um	1.6um	1.4um
聚焦深度 (±D.F)	7.1um	2.1um	1.5um
透射率超过 70%	1000 - 2100nm	1000 - 2000nm	1000 - 2000nm
重量	490g	610g	560g

注：分辨率和焦深是使用波长参数 ($\lambda=1.55\mu\text{m}$) 计算的。

$$R=0.61 \times 1.55/N.A \text{ 焦深} \pm D (\mu\text{m}) = \lambda/[2 (N.A)^2]$$